

の安全とテスト  
車載レッジに対する検証要求はかつてないほど高まっています。この結果  
SoCデザインの検証フローに欠かせない要素として注目を集め  
以て高速なICの故障安全と高効率な故障削減も検証要求は高まら  
シノプシス

TestMAX™ CustomFaultは、サブシステムおよびチップ  
レベルのアナログ故障シミュレーションを可能にする画期的なシミュレ  
タ新製品です。業界をリードするFastSPICEテクノロジー、および高度  
差別化された機能の数々を搭載することで、機能安全およびテスト・カ  
レッジ解析にかかる時間をSPICEベースのソリューションに比べ数桁短

## 主な特長

スループット/容量	使い易さ	診断/レポート機能
<ul style="list-style-type: none"><li>• 業界をリードする FastSPICE</li><li>• 業界最高速度のデジタル・エンジン VCSとの統合によるミックスドシグナル検証</li><li>• 適応型サンプル抽出によりシミュレーション回数を 1/10 ~ 1/1000 に削減</li><li>• 高度なスコープ設定</li><li>• 分散シミュレーション</li><li>• インクリメンタル故障シミュレーション</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 非介入型の故障注入</li><li>• GUI/バッチ・モードによるセットアップ</li><li>• ユーザー設定可能な故障モデル、C kcalギ 0 cal</li></ul>	

## 幅広い故障モデルをサポート

TestMAX CustomFaultは、一般的なオープン/ショート故障モデルや過渡故障、パラメトリック故障を含め、幅広い故障モデルをサポートしています。

故障モデル	故障タイプ
致命的な単一点故障	MOSFET オープン/ショート故障 • 6つのショート故障と4つのオープン故障 • 0/1縮退故障を含む • マクロ・モデルをサポート
	デザイン・レジスタ、キャパシタ、ダイオード、インダクタ、BJT、JFET • オープンおよびショート
過渡故障	ソフト・エラー (SEU) • 目的のノードにおける電流パルスのパラメトリック・シミュレーションが可能
パラメトリック故障	MOSFETパラメータの変動 • W、L、Idsat

## 高度な診断 / レポート機能

TestMAX CustomFaultは包括的なレポート/診断機能を備えており、レポートを簡単に生成して効率よくデバッグが行えます。

### 主な特長

- 全数およびサンプルに対する洞濶 え誕睢 過完 寧妖 ー



日本シノプシス合同会社

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ オフィス  
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 ビアスタワー13F

TEL.03-6746-3500(代) FAX.03-6746-3535  
TEL.06-6359-8139(代) FAX.06-6359-8149